

AGENDA, MITTWOCH, 27.10.2010

09:30	Begrüßung: Michael Dams, Director Central Europe, National Instruments Keynote: Johannes Lackmann, Geschäftsführer, VDI Zentrum Ressourceneffizienz									
10:30	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung									
	Fertigungs- und Baugruppentest (Stadtsaal)	LabVIEW Software Engineering (Kleiner Saal)	Mess- und Prüftechnik (Neue Bühne Bruck)	Halbleitertest (S5)	Daten-Streaming & vielkanalige Messsysteme (Fürstenfeld 2&3)	Prüfstandsautomatisierung (Säulensaal)	Design & Test im Automobilbereich (S1)	Workshops für Einsteiger (S3)	Workshops für Fortgeschrittene (S6)	
11:00 – 11:30	The Future of Automated Test – Essential Test Technologies and Methods Richard McDonell, National Instruments	The Software Engineering Process for Large LabVIEW Applications Elijah Kerry, National Instruments	Neue Produkte der Mess- und Prüftechnik in der Anwendung Marian Olef, National Instruments	Semiconductor Test with NI Components Travis White, National Instruments	Data Streaming Architectures in PXI Systems Christian Gindorf, National Instruments	Das universelle Messsystem – Wunsch oder Wirklichkeit? Jörg Vetter, ITK Engineering	Erfassung der Laufflächenkontur von Pkw-Reifen bei hohen Geschwindigkeiten Rene Armbruster, Karlsruher Institut für Technologie	Interaktives Messen und Prüfen mit LabVIEW SignalExpress Einführung in die interaktive Messsoftware LabVIEW Signal-Express, die Erfassung, Analyse und Darstellung von Daten verschiedener Datenerfassungs- und Messgeräte vereinfacht Matteo Bax, National Instruments	Echtzeittest mit VeriStand Erhalten Sie eine Einführung in die sofort einsatzbereite Softwareumgebung NI VeriStand für die Konfiguration von Echtzeitprüfanwendungen einschließlich Hardware-in-the-Loop-Prüfungen Carsten Sckopke, National Instruments	
11:30 – 12:00	Eine Standardplattform von Produktionstestsystemen für Medizingeräte – Erfahrungen eines Plattformwechsels Axel Bauer, Philips Medizin Systeme	Strukturen und Elemente für ein „Application Framework“ in LabVIEW Michael Schmidt, MSC Measurement Solution Consultants Ingenieurbüro	TUTORIUM: Messgerätesteuerung mit NI LabVIEW Andreas Scholz, National Instruments	Design of a Real-Time System for in-situ Characterization of Smart Power Switches during Cycle Stress Testing Benjamin Steinwender, KAI Kompetenzzentrum für Automobil- und Industrie-Elektronik	Einführung in das Peer-to-Peer-Datenstreaming Christoph Landmann, National Instruments	Entwicklung und Konstruktion eines Haptikversuchsstandes zur Analyse haptischer Wahrnehmungen von Materialoberflächen durch physikalische Messwerte und subjektive Bewertungen Manfred Renner, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT	Hochdynamische Prüfstände für elektrisch angetriebene sicherheitsrelevante Automotiv-Komponenten Dr. Gregor Diehl, GADV – Gesellschaft für Automatisierung mit Datenverarbeitungsanlagen Stefan Knöß, Dr. Thomas Meinders, TRW Automotive			
12:00 – 12:30	Erweiterung der NI-Testplattform um ein Konzept zur vollständigen Aufzeichnung und hardwareunabhängigen Wiedergabe eines Testlaufs Bernhard Renz, Philips Medizin Systeme	Verbesserung der Codequalität durch Bewertung der Komplexität mit dem VI Analyzer Lutz Andrews, Siemens HIM CV Torsten Will, Data Ahead	Entwicklung eines portablen Analysengeräts zur Bestimmung von Nanoteilchen in Flüssigkeiten Bartjan den Hartogh, Tom Forrer, nanotion	ABex – Nächste Generation des PXI-basierten Halbleitertests Michael Konrad, Konrad Technologies	ECHSE – Funksignale breitbandig aufzeichnen, mehrkanalige Echtzeit-Digitalisierung, Filterung und Langzeitspeicherung Ulrich Wessel, Schönhofer Sales and Engineering	Entwicklung dezentraler, EtherCAT-basierter Systeme – Neuerungen & NI Roadmap Daniel Riedelbauch, Philipp Dittrich, GÖPEL electronic	EOL-Prüfsystem zur Validierung von Fahrzeugsitzen unter Einsatz von elektromechanischen und optischen Messkomponenten Regina Walch, National Instruments	Einführung in LabVIEW Einführung in die grafische Programmiersprache NI LabVIEW anhand praktischer Beispiele Regina Walch, National Instruments	Deterministische Anwendungen mit LabVIEW Real-Time Die Entwicklungs-umgebung LabVIEW, das LabVIEW Real-Time Module und die Hardware der RT-Serie von National Instruments ermöglichen eine deterministische Echtzeit ausführung für Datenerfassungs-, Steuer- und Regelsysteme Ralf Nitzsche, National Instruments	
12:30 – 13:00	Evaluierung der neuesten Intel® Microarchitekturen und deren Einflüsse für die Zukunft des Tests Johannes Bauer, National Instruments	Software-Engineering in der Praxis – Werkzeuge für optimierte LabVIEW-Entwicklung Helge Taubert, Zühke Engineering	TUTORIUM: Fallstricke präziser DC-Messungen Moritz Mayer, National Instruments	Konzept zur Implementierung von echtzeitfähigen Steuerungen mit LabVIEW auf der Plattform CompactRIO (Halbleiterproduktion) Peter Reinsner, Infineon Technologies Austria	Vielkanaldatenerfassung bei dynamischen Versuchen im kryogenen Windkanal Sebastian Büsing, Werner Just, RWTH Aachen	Motion Simulator Controlled via EtherCAT Robin Hauser, ACUTRONIC Switzerland	Roboter- und LabVIEW-basiertes Universaltestsystem für Kfz-Bedienkomponenten Herbert Pichlik, SYSTEC			
13:00	Mittagsbuffet/Besuch der Ausstellung									
14:30 – 15:00	Themenkreis Virtual Test und automatische Testplangenerierung aus ATML Daniel Glaser, Universität Erlangen	LabVIEW Power Programming (Kleiner Saal) LabVIEW-Anwendertreffen Ulrich Möschel, Elijah Kerry, National Instruments	Universelle Automatisierung im Elektronikkolabor mit dem „CTVLab“ basierend auf LabVIEW Stephan Reutzel, Continental Teves Kai Larsen, MSC Measurement Solution Consultants Ingenieurbüro	Business-Trends (S5) Understanding the True Cost of Test Richard McDonell, National Instruments	Design & Test in Aerospace/Defense (Fürstenfeld 2&3) Real-Time Testing of Complex Avionics Systems Frank Wiedmann, National Instruments	Haushaltsgeräteentwicklung mit Qualität unterstützt von TestMaster und LabVIEW Dr. Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik	ACANIS – Ein universelles Software-Tool für CAN-Netzwerke Klaudius Pinkawa, A.M.S. Software	PC-basierte Datenerfassung mit LabVIEW Verwendung der Datenerfassungshardware von National Instruments in Verbindung mit NI LabVIEW Fabian Topper, National Instruments	Projekte mit der NI-CompactRIO-Plattform und LabVIEW FPGA Der Workshop bietet eine Einführung in die Programmierung des CompactRIO mit LabVIEW Real-Time und LabVIEW FPGA Christian Mergl, Andreas Stark, National Instruments	
15:00 – 15:30	Traceability from Design to Test – durchgängige Überprüfung der Anforderungen bei der Entwicklung eines Testers Frank Heidemann, SET		TUTORIUM: NI CompactDAQ under the Hood Peter Adelhardt, National Instruments	Chancen und Herausforderungen von Standardisierungen im Bereich Test & Validierung Jürgen Wölflé, Continental AG	NI PXI Controls Cryogen Cooling System in the European Transonic Windtunnel (ETW) Christian Kühn, European Transonic Windtunnel Dr. Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik	Testautomatisierung aus einem Guss mit LabVIEW, Ranorex und dem Team Foundation Server Dirk Beinert, Andreas Turk infoteam Software	Effiziente Durchführung von Fahrdynamiktests mit MOSES und MOSES PDA Andreas Pfister, Daimler			
15:30 – 16:00	TUTORIUM: „From Requirements to Test“ – Live-Demonstration der NI-Software-Toolkette Robert Halas, National Instruments	Prototyp für ein LabVIEW-OOP-basiertes mobiles Agentensystem Frederik Berck, Dr. Holger Brand, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung	LabVIEW prüft Sicherheitssystem zum Schutz vor Überdrehzahl bei Großdieselmotoren für Containerschiffe Roland Spiegel, Noris Marine Systems	Industry Trends & Investment Areas of NI Richard McDonell, National Instruments	Install a Measurement Acquisition Facility with Online Data Server Capabilities with NI PXI and LabVIEW RT Marcel Stöbel, Universität der Bundeswehr München	Modulare Softwarearchitektur für die datenbankgestützte Laborautomatisierung Ulf Flemig, GROHE Dr. Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik	Zeiteinsparung bei der Entwicklung und Prüfung von Nutzfahrzeugen durch automatisierte Messdatenauswertung mit NI DIAdem Sven Armbrust, Daimler			
16:00	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung									
16:30 – 17:00	Noch mehr Durchblick in der Fertigung – Proligent 5.0 „Die Engineering-Testplattform für Variantenmanagement, Traceability, Testerverwaltung, Reports“ Markus Solbach NOFFZ ComputerTechnik	Tipps und Tricks rund um LabVIEW Tobias Daub, National Instruments	TUTORIUM: Datenerfassung verstehen mit NI LabVIEW Diana Stöckert, National Instruments	Das optimale Lizenzmodell – Kosten sparen bei gleichzeitiger flexibler Nutzung Georg Plasswilm, National Instruments	Electromagnetic Pollution, Spectrum Erosion and Passive Radars Riccardo Mancinelli, SELEX Sistemi Integrati	Konsequenzen und Umsetzung der neuen Maschinenrichtlinie mit LabVIEW am Beispiel eines Hochdruckprüfstandes Asif Khan, MS2 Engineering und Anlagenbau Christian Schleicher, Festo	E-Motoren-Simulation basierend auf FPGA-Technologie Franz Dengler, MicroNova	Interaktives Datenmanagement und Berichterstellung mit DIAdem Einführung in die Programmbedien- und Visualisierungsaufgaben Alexander Glaser, National Instruments	Schall- und Schwingungstechnik mit LabVIEW und NI CompactRIO Die Software für Geräusch- und Schwingungsanalysen von NI stellt eine vollständige Lösung für alle Akustik, Elektroakustik, NVH- und Maschinenzustandsüberwachungsanwendungen zur Verfügung Bernd Fasching, National Instruments	
17:00 – 17:30	FLEXSTAND OI – a new Flexible TestStand Operator Interface Morten Pedersen, CIM Industrial Systems		TUTORIUM: Temperatur-, Dehnungs- und Impedanzwerte richtig erfassen Jochen Klier, National Instruments	The Business of Obsolescence Planning Richard McDonell, National Instruments	ARINC Interfaced Flight Test Equipment Using the CompactRIO Platform Frank Heidemann, SET Falk Hoffmann, Eurocopter Deutschland	SARA-Prüfstandsautomatisierung in der Verfahrenstechnik Christian Haeske, measX	NI-XNET – Neuerungen für den Test von Bordnetzwerken in Hard- & Software Andreas Stark, National Instruments			
17:30	Pils vom Fass im Ausstellungsbereich									

AGENDA, DONNERSTAG, 28. 10. 2010

09:00	Keynote: Rahman Jamal, Technical Director Central Europe, National Instruments Live-Demonstrationen neuer Technologien und Produkte aus dem R&D-Center von National Instruments								
10:30	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung								
	Fertigungs- und Baugruppentest (Stadtsaal)	LabVIEW Power Programming (Kleiner Saal)	RF- und Wireless-Test (S5)	FPGA-basiertes Systemdesign (Neue Bühne Brück)	Robotik und Mechatronik (Fürstenfeld 283)	Technisches Datenmanagement (S1)	Validierung von Embedded-Systemen (Säulensaal)	Workshops für Einsteiger (S3)	Workshops für Fortgeschrittene (S6)
11:00 – 11:30	Get the total coverage – Teststrategien zur Qualitätssicherung Holger Göpel, GOPEL electronic	LabVIEW under the Hood Elijah Kerry, National Instruments	Wireless-Kommunikation, Ortung und Navigation für innovative Verkehrsinformationssysteme Prof. Dr. Oliver Michler, TU Dresden	Advantages of FPGA-based System Design John Pasquarette, National Instruments	Robotik und Mechatronik in Lehre und Forschung – Trends und Entwicklungen durch Interaktion von Lehre, Forschung und Industrie Ingo Földvári, National Instruments	Messdaten auswerten mit MS Excel oder DIAdem? Eine Gegenüberstellung für typische Aufgaben bei der Messdatenauswertung Andreas Haub, National Instruments	Von den Requirements zum automatisierten Test Stephan Ahrends, National Instruments	Messgerätesteuerung mit LabVIEW und Tektronix-Oszilloskopen Messgerätesteuerung bedeutet: Software auf einem PC einzusetzen, um ein Messgerät dezentral über einen Steuerbus zu kontrollieren. Dieser Workshop demonstriert dies mit Hilfe von Tektronix-Oszilloskopen Ramona Mathews, National Instruments	Von der Schaltungssimulation zum Leiterplattenentwurf mit der NI Circuit Design Suite In diesem Workshop werden Disziplinen der professionellen Elektronikentwicklung präsentiert von der intuitiven Schaltplangebung und der interaktiven SPICE-Simulation bis hin zum leistungsstarken Leiterplattenentwurf mit integriertem Autorouting Thomas Baumecker, National Instruments
11:30 – 12:00	Steigerung der Produktionseffizienz von Umrichterprüfplätzen mittels FPGA-Technologie Peter Nagengast, Siemens – Drive Technologies Division		What's on the RF Roadmap? Neue RF-Produkte von National Instruments Ewa Napieralska, National Instruments	Einsatz des NI Labs C FPGA Interface zur Steuerung von Hochspannungsgeneratoren in der Röntgentechnik Amira Romani, Siemens Healthcare Sector	Entwurf autonomer mobiler Systeme – NI LabVIEW Robotics als Standardhard- und -softwareplattform für mobile Robotersysteme Jochen Klier, National Instruments	Versuchsmanagement ohne Datenbank: Voith Hydro setzt im Turbinenversuch auf TDM, DIAdem und DataFinder Karl Finkl, a-solution	Mechatronisches Systems Engineering – Grundlagen für automatisches Testen Dr. Rainer Stetter, ITQ Artur Pilz, Avery Dennison Deutschland		
12:00 – 12:30	Dynamische PWM-Erfassung – vom Entwicklungsmessgerät zur Serienanlage einfach und schnell durch FPGA-Technologie Tobias Starz, Hartmann Exact	Die LabVIEW-Plattform – eine Software für alle Hardwarezielsysteme Peter Adelhardt, National Instruments	Zulassung von ISM-Funkmodulen und Kostenoptimierung in der Serienproduktion Thomas Rieder, PROBARE	Test von Glasfaserkommunikation bis zu 2,5 Gbit/s auf Basis von NI FlexRIO Michael Rost, IRS Systementwicklung	Mikroprozessorbasierte mobile Roboter – Entwicklung von LabVIEW für ARM/Blackfin-basierte Controllerboards für Anwendungen in der Mechatronik und Robotik Dr. Stefan Enderle, qfx robotics Marco Schmid, Schmid Engineering	Mit LabVIEW Messdaten effektiv speichern und weiterverarbeiten Eva Tipl, National Instruments	How to Describe your System Behaviour – The NI Way Ian Fountain, National Instruments	Grundlagen in LabWindows/CVI Einführung in die ereignisorientierte ANSI-C-Programmierung umgebung LabWindows/CVI Susanne Seidl, National Instruments	VI-Scripting – LabVIEW programmiert sich selbst! Automatisierung der LabVIEW-Programmierung zur Steigerung der Produktivität und für die Erstellung eigener Funktionen und Werkzeuge mittels VI Scripting, das Anwendern die Entwicklung eines LabVIEW-Programms ermöglicht, welches LabVIEW-Code erzeugen und prüfen kann Christian Mergl, National Instruments
12:30 – 13:00	Haptik- und Akustiktest von Automotive-Bedienelementen und -Schaltern mithilfe der Soundanalyse Timo Nittke, Zwick/Roell Michael Konrad, Konrad Technologies		Multifunktionales UHF-RFID-Transpondertestsystem – Aufbau, Funktionen und Anwendungen Thomas Holtstiege, European EPC Competence Center	FPGA-based Feedback Control of a Single Atom Trajectory Christian Sames, Max-Planck-Institut für Quantenoptik	Fraunhofer VolksBot mit NI CompactRIO und NI LabVIEW – Erfahrungen aus der Lehrveranstaltungsreihe „Teamrobotik“ der Universität Magdeburg Dr. Ansgar Bredenfeld, Fraunhofer IAIS Manuela Kanneberg, Universität Magdeburg	MBTAPS „Mercedes Benz Truck Analysis Platform System“ auf der Basis von X-Frame und DIAdem Mathias Harlfinger, Daimler Dr. Joachim Hilsman, measX	Vom funktionalen Entwurf mit physikalischer Modellierung bis zum vollständigen Test mechatronischer Systeme in der virtuellen und realen Umgebung Jens Schindler, ITI		
13:00	Mittagsbuffet/Besuch der Ausstellung								
14:30 – 15:00	Boundary Scan – 20 Jahre standardisierte Innovationen IEEE 1149.1 Mario Berger, GOPEL electronic	Power Programming – Neuerungen in der LabVIEW-Plattform Klaus Dinnes, National Instruments	Wideband RF Record & Playback for Multi-Constellation GNSS Manuel Bogedain, NOFFZ ComputerTechnik	FPGA-basierte Analyse eines proprietären Bussystems mit NI LabVIEW FPGA und NI Single-Board RIO Dennis Schmidt, WAGO Kontakttechnik	Real-Time-MathScript für autonome mobile Roboter – Integration von textbasierter Mathematik und grafischer Programmierung für Echtzeitanwendungen Balázs Tóth, National Instruments	DIAdem 2010: Vorstellung der neuen Version und Möglichkeit zum direkten Erfahrungsaustausch mit der DIAdem-Entwicklung Andreas Haub, Walter Rick, National Instruments	Effizienter Einsatz von Fahrzeug-Simulationsmodellen in der Komponenten- und Regelsystementwicklung Oliver Philipp, TESIS DYNAware	Industrielle Bildverarbeitung mit Vision Builder AI NI Vision Builder AI ist eine interaktive, konfigurierbare Programmierumgebung, mit der Bildverarbeitungsanwendungen ohne Programmieraufwand erstellen, analysiert und ausgeführt werden können Beat Schib, National Instruments	Performance-Optimierungen für LabVIEW-Projekte Dieser Workshop zeigt Ihnen die häufigsten Performance-„Fallen“, die es in LabVIEW gibt. Dabei werden sowohl die Aspekte des Speicherbedarfs als auch die Abarbeitungsgeschwindigkeit betrachtet Marco Brauner, National Instruments
15:00 – 15:30	Erweiterung des klassischen In-Circuit-Test ICT durch kombinierte Testverfahren Ernst Neppel, Zollner Elektronik Michael Konrad, Konrad Technologies		Reducing Test Times for WLAN Modules Using Modular Instruments Ken Tobler, National Instruments	STACS L51 – Ein ATE der 1000-Kanal-Klasse Heinrich Kiehm, Kiehm Datenmanagement	Steuerung von Robotern über Smart-Devices – Einsatz von TCP/UDP/WLAN zur Kommunikation zwischen Forschungsroboter FORBOT und iPhone Mathias Hubrich, Philipp Ochtenberg, Roboterwerk	Validieren der Spezifikationen durch frühzeitiges Embedded Rapid Prototyping Marco Schmid, Schmid Engineering			
15:30 – 16:00	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung								
16:00 – 16:30	Sensor-guided Robotics powered by DENSO and LabVIEW – einfache Flexibilität für Fertigungstests Alexander Kempf, DENSO EUROPE	Leistungs- & Geschwindigkeitssteigerung von LabVIEW-Projekten Sebastian Kleinau, National Instruments	RF Advanced Technologies Ken Tobler, National Instruments	LabVIEW FPGA under the Hood Wolfgang Zwick, National Instruments	Echtzeitmodellierung und Simulation von Elektrofahrzeugen – Aufbau eines Demonstrators mit NI VeriStand und SimulationX zur Abbildung eines elektrisch betriebenen Allrad-Buggys Torsten Blochwitz, Jens Schindler, ITI	10 Tage Test in nur 20 Minuten auswerten? Möglichkeiten zur einfachen Bedienung für eine effiziente Datenanalyse mit DIAdem Walter Rick, National Instruments	Flexible HIL-Simulation für die Haugeräteentwicklung Johannes Weingarten, evopro systems engineering	Grundlagen in TestStand NI TestStand ist eine sofort einsatzfähige Testmanagementsoftware, die das Entwickeln automatisierter Prüf- und Validierungssysteme erheblich beschleunigt Houssam Kassri, National Instruments	Workshop In-Circuit-Test Matthias Vogel, Konrad Technologies Marco Sliwa, JTAG Technologies
16:30 – 17:00	Anspruchsvolle Switch-Konfigurationen für große Testsysteme Norbert Brand, National Instruments				High-Fidelity Robotersimulation mit LabVIEW und USARSim – Anbindung von LabVIEW an den 3D Grafik- und Physiksimulator USARSim zur Multi-Roboter-Simulation Christoph Gruber, UMIT-Private Universität Hall in Tirol	Lingua Franca für Messdaten. Geeignete Migrationsverfahren für die Erstellung und Vereinheitlichung von Datenablagen Andreas Haub, National Instruments	Dynamisches Testen von Komponenten und Embedded-Systemen in Echtzeit Balázs Tóth, National Instruments		
17:00	ENDE								